

تأثیر غلظت نیترات نقره بر تشکیل نانو ذرات نقره در سیستم Ag-SiO₂ به روش سل-ژل

عیاس باباپور، لاله سمیعی، امید اخوان و علیرضا مشفق

دانشکدهٔ فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف

moshfeqh@sharif.edu : سیستم الکترونیک

(دریافت مقاله: ۸۵/۲/۳۱؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۸۶/۹/۲۵)

چکیدہ

در این تحقیق، سیستم لایه نازک Ag-SiO₂ با غلظت‌های مختلف نقره (۰/۲٪، ۰/۴٪، ۰/۶٪ و ۰/۸٪) بر سطح زیرلایه soda-lime ساخته شد. پس از مرحله پخت نمونه‌ها، بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی لایه‌های نازک سیلیکا (SiO₂) حاوی نانوذرات نقره، توسط اندازه‌گیریهای اپتیکی برای تعیین خواص نوری لایه‌ها، توپوگرافی و ریزساختار نمونه‌ها توسط میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، اندازه‌گیری دقیق سایز نانوذرات نقره و توزیع آنها در سطح و حجم لایه‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) انجام شد. بر اساس تحلیل نتایج به دست آمده از روش‌های مذکور، بدون انجام عملیات حرارتی مناسب، نانوذرات نقره در غلظت‌های خیلی کم نقره (۰/۲٪) و یا خیلی زیاد آن (۰/۸٪) تشکیل نمی‌شوند، بلکه با در نظر گرفتن غلظت اولیه نقره در یک ناحیه میانی این امر صورت می‌گیرد. در واقع نانوذرات Ag در این غلظت‌های حدی در دمای پخت ۲۰۰°C تشکیل می‌شود. همچنین بر اساس مشاهدات TEM، حداقل متوجه اندازه ذرات سنتز شده، برای غلظت

واژه‌های کلیدی: نانو ذرات، روش سل - ژل، لایه نازک

١. مقدمة

مختلفی شروع شده است. لایه‌های شفاف حاوی نانوذرات فلزی دارای جذب پلاسمونی در ناحیه مرئی هستند [۲]، بنابراین با انتخاب فلز مناسب و کنترل سایز و غاظت ذرات در بستر می‌توان پوشش‌هایی با طیف وسیعی از رنگها ساخت. علاوه بر این پوشش‌های حاوی نانوذرات فلزی و اکسیدی آنها به عنوان مواد نانوساختار در زمینه‌های پژوهشی و کاربردی مانند پوشش‌های محافظ، فیلترهای نوری، سوئیچهای نوری، حسگرها، کاتالیستها و کاربردهای الکترونیکی اخیراً مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند.

در این تحقیق نانوذرات نقره به دلیل ویژگی‌های جالب توجه اپتیکی [۳،۴]، کاتالیستی [۵]، ضد باکتریایی [۶] و الکترونیکی، در لایه نازک SiO_2 توسط روش سما-ژل با غلظتهای مختلف

با گذراز میکروذرات به نانوذرات، با تغییر برخی از خواص فیزیکی روبه رو می شویم، که دو مورد مهم آنها عبارت اند از: افزایش نسبت سطح به حجم (A/V) و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتمی [۱]. افزایش نسبت V/A که به تدریج با کاهش اندازه ذره رخ می دهد، باعث غلبه یافتن رفتار اتمهای واقع در سطح ذره به رفتار اتمهای درونی می شود. این پدیده بر خصوصیات ذره در حالت ایزوله و بر تعاملات آن با دیگر مواد اثر می گذارد. همچنین افزایش سطح، عاملی کلیدی در کارکرد سیستمهای متكامل به ویژه کاتالیستها به شمار می آید. در سالهای اخیر وارد کردن نانوذرات فلزی یا نیمرسانا در مواد و بسترهای شفاف نظیر شیشهها با اهداف کاربردی

میزان نیترات نقره‌های مورد استفاده، اندازه ذرات نانومتری تهیه شده را کنترل می‌کند. پس از آماده شدن سل و برای آنکه سل مورد نظر برای انجام عملیات لایه‌نشانی آماده شود باید ویسکوزیته آن به طور متوسط در حدود 3 cP باشد. پس از آماده شدن سل، عملیات لایه‌نشانی با سرعت 1 mm/sec بر سطح زیر لایه‌های soda-lime انجام شد [7]. ژله‌ای تشکیل شده بر روی سطح زیرلایه، در یک کوره و در محیط هوا در دمای 100°C به مدت یک ساعت خشک شدند. پس از خشک کردن نمونه‌ها، آنها در یک کوره لوله‌ای در دمای 200°C در محیط هوا به مدت ۲ ساعت پخت شدند.

۳. روش‌های مشخصه‌یابی

به منظور بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی نمونه‌های ساخته شده از روش‌های مختلف استفاده گردید. این مطالعات شامل اندازه‌گیریهای اپتیکی، ساختاری و ترکیب شیمیایی است. در این تحقیق، از اندازه‌گیریهای اپتیکی به روش اسپکتروفتومتری نورمرئی - ماورای بنتش (UV-Vis)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد. در زیر نتایج هر کدام از این تکنیکها ارائه و تحلیل خواهد شد.

۴. نتایج و بحث

پس از آنکه نمونه‌های حاوی ذرات نانومتری نقره تهیه شدند، مورفولوژی سطح آنها را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM مورد مطالعه قرار دادیم. این آنالیز به ما کمک کرد تا بتوانیم کیفیت سطح نمونه‌ها را بررسی و ارزیابی نماییم. چون اندازه ذرات در ابعاد نانومتری بودند نیاز داشتیم تا از میکروسکوپ الکترونی روبشی با توانایی تفکیک بالا^۱ استفاده کنیم. شکل ۱ تصویر HRSEM نمونه‌های با غلظت 0.2% و 0.4% را که با بزرگنمایی 10^5 برابر گرفته شده است، نشان می‌دهد. ذرات روش مشاهده شده در سطح نمونه‌ها با استفاده از آنالیز تکمیلی EDAX، نقره شناسایی شدند. همان طور که

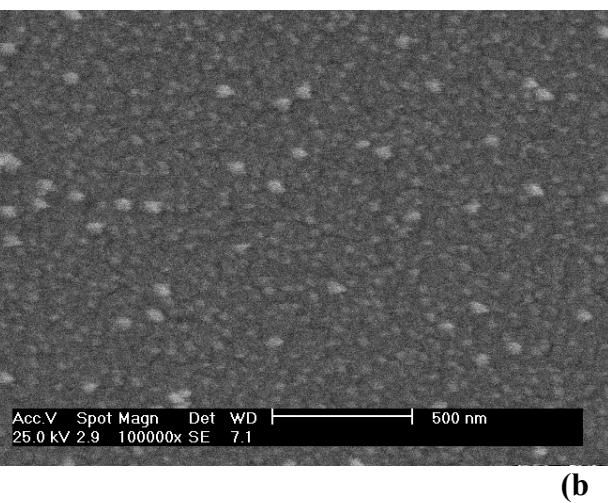
نقره ساخته شدند. مشخص گردید که برای تشکیل نانوذرات نقره یک حد بالا و پایینی در انتخاب غلظتها وجود دارد، به طوری که با کاهش زیاد غلظت، نانوذراتی با شکل کاملاً متفاوت نسبت به ذرات تشکیل شده در بقیه غلظتها تشکیل شدن. همچنین با افزایش بیش از حد غلظتها نقره، اندازه ذرات تشکیل شده بسیار بزرگ شده به طوری که خواص حالت کپهای از خود نشان می‌دهند.

۲. روش ساخت

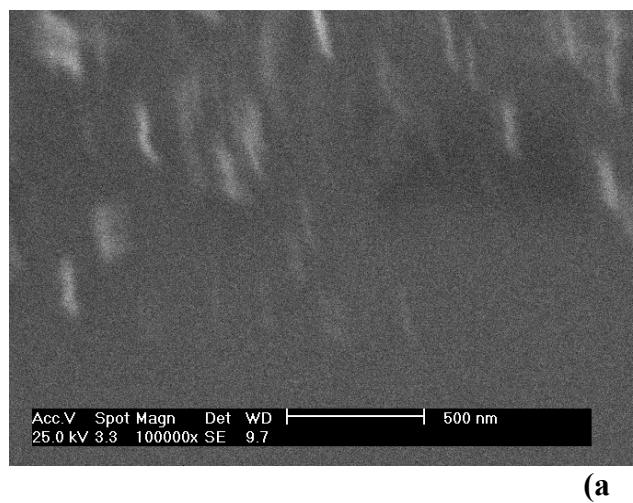
برای تهیه لایه نازک سیلیکا (SiO_2) حاوی نانوذرات به روش سل - ژل می‌توان از تکنیکهای مختلف لایه‌نشانی استفاده کرد. در اینجا از روش غوطه‌وری برای تهیه لایه نازک سیلیکا استفاده شد. برای آنکه بتوان نانوذرات را در این ماتریس ایجاد کرد، ابتدا در مرحله تهیه سل، پیش ماده لازم برای تهیه ذرات نانومتری مورد نظر به آن اضافه می‌شود. سپس طی انجام فرآیند لایه‌نشانی و خشک کردن، ذرات مورد نظر به صورت آزاد و در همه جای سطح و حجم بستر SiO_2 ایجاد می‌شوند. برای ساخت لایه نازک سیلیکای حاوی نانوذرات نقره، از مواد مختلف با مقادیر مناسب شامل ترااتیل اورتوسیلیکات (TEOS)، اتانول ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)، آب مقطمر (H_2O)، نیترات نقره (AgNO_3) و اسید نیتریک (HNO_3) به عنوان مواد اولیه استفاده کردیم.

ابتدا TEOS و اتانول را با حجم‌های یکسان با هم مخلوط نموده و آن را به مدت نیم ساعت با همزن مغناطیسی هم می‌زنیم. سپس در حالی که محلول اول با شدت زیاد در حال هم خوردن است قطره قطره آب مقطور به آنها اضافه می‌شود و در نهایت اسید نیتریک به عنوان کاتالیست به محلول بالا افزوده می‌شود. مقدار مواد استفاده شده در این فرآیند بدین صورت بود که به ازای هر مول TEOS، به مقدار $3/825$ مول اتانول، 4 مول آب مقطر، 2 قطره اسید نیتریک و مقادیر مختلف نیترات نقره مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر مختلف نیترات نقره بر حسب درصد مولی نسبت Ag/Si انتخاب شدند. برای این کار از نسبتهای $0.2/0.04$ ، $0.2/0.06$ و $0.2/0.08$ در این تحقیق استفاده شد.

¹. High Resolution Scanning Electron Microscope

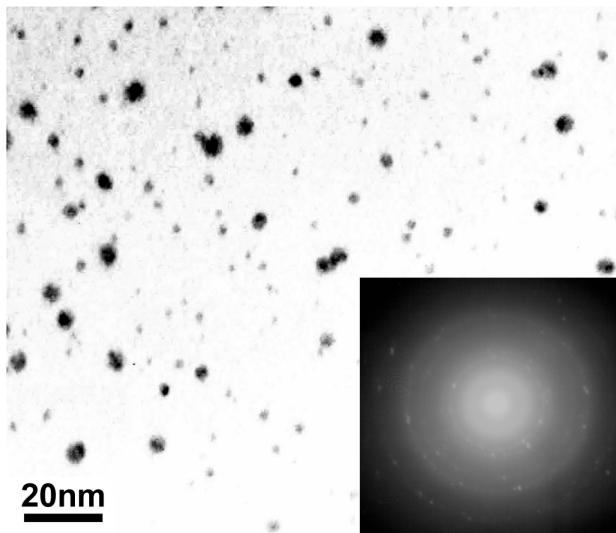


(b)



(a)

شکل ۱. تصویر HRSEM لایه‌های نازک SiO₂ حاوی ذرات نانومتری نقره با غلظتهای (a) ۰/۲٪ و (b) ۰/۴٪ که در دمای ۱۰۰°C خشک شده‌اند.

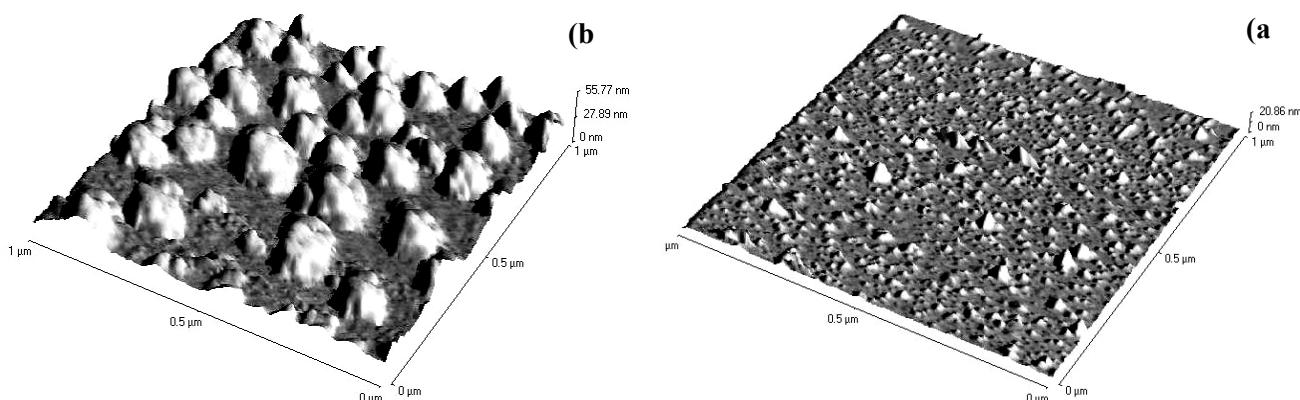


شکل ۲. تصویر TEM لایه‌های SiO₂ حاوی نانوذرات نقره با غلظت ۰/۲٪ و تصویر الگوی پراش آن در دمای پخت ۲۰۰°C.

که کاهش مناسب غلظت نقره و شرایط مناسب، موجب کم شدن میانگین اندازه ذرات می‌شود. به منظور تعیین ساختار کریستالی نانو ذرات نقره، از مدد پراش تکنیک TEM استفاده شد. تصویر داخلی در شکل ۲ الگوی پراش الکترونها را برای نمونه ۰/۲٪ نقره که در دمای ۲۰۰°C پخت شده است، نشان می‌دهد. از این تصویر و طرح مربوط به حلقه‌های به دست آمده از نمونه، مشخص گردید که ذراتی که در تصاویر TEM مشاهده می‌شوند

مشاهده می‌شود در غلظت خیلی کم نقره، نانوذراتی تشکیل نمی‌شوند. این در حالی است که با پخت این نوع نمونه‌ها در دمای ۲۰۰°C نانوذرات کروی و با توزیع خوب به دست آمدند. اما با افزایش غلظت نیترات نقره با مقدار مناسب، نانوذرات با شکل کروی تشکیل شدند که به خوبی در همه جای سطح نمونه به طور یکنواخت توزیع شده‌اند. شایان ذکر است که با افزایش غلظت نیترات نقره نانوذراتی با اندازه‌های مختلف که تابع غلظت نیترات نقره می‌باشد به دست می‌آیند [۸]. براساس تحلیل نتایج به دست آمده، متوسط اندازه ذرات برای نمونه‌های با غلظت ۰/۴٪ در حدود ۱۲ nm تعیین گردید.

به منظور تعیین اندازه دقیق نانوذرات Ag و همچنین بررسی چگونگی توزیع ذرات در حجم لایه نازک SiO₂، از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نیز استفاده شد. شکل ۲ تصویر TEM لایه SiO₂ با غلظت نقره ۰/۲٪ را که در دمای ۲۰۰°C پخت شده است، نشان می‌دهد. براساس نتایج TEM، متوسط اندازه ذرات از این نوع نمونه‌ها حدود ۴ nm اندازه‌گیری شده است. همان طور که مشاهده می‌شود نانوذرات نقره در همه جای لایه‌های بستر سیلیکا پخش شده‌اند و از توزیع یکنواختی برخوردار هستند. همچنین از مقایسه این تصویر و تصویر SEM نمونه حاوی ۰/۴٪ می‌توان نتیجه گرفت



شکل ۳. تصاویر سه بعدی AFM لایه‌های نازک سیلیکا با غلظت‌های a) ۱/۶٪ و b) ۸٪ نقره در دمای ۲۰۰°C.

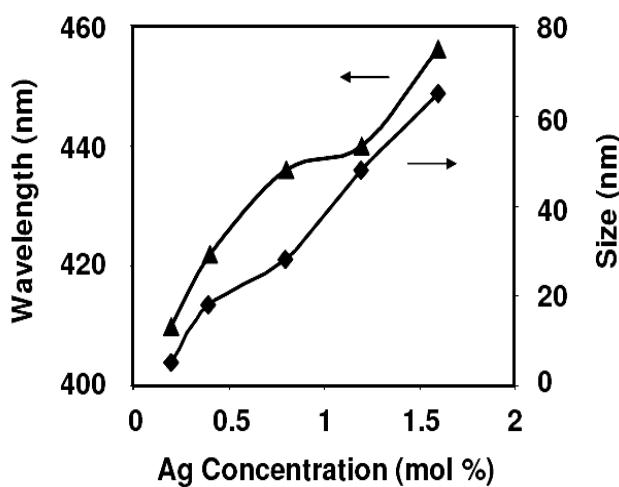
[۱۱]. به منظور بررسی تجربی این اثر، خواص اپتیکی نمونه‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. شکل ۴ نمودار طیف جذبی لایه نازک سیلیکا حاوی ۰/۲٪، ۱/۶٪ و ۸٪ نقره را در دو دمای مختلف نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود در غلظت میانی ۱/۶٪ در هر دو دما قله جذبی نقره دیده می‌شود. در غلظت‌های بالا (۸٪) این قله پس از پخت نمونه‌ها ظاهر می‌شود که بیانگر تشکیل نانوذرات به کمک دما است و در دمای ۱۰۰°C ذرات نقره در حالت کپه‌ای قرار دارند در حالی که در حالت غلظت‌های کمتر در هر دو دما قله جذب مربوط به نانوذرات نقره را مشاهده کردیم. در غلظت‌های بین ۰/۲٪ و ۸٪ بدون انجام عملیات حرارتی، قله‌های جذبی که نشان‌دهنده تشکیل نانوذرات هستند در طیف اپتیکی نمونه‌ها مشاهده شدند.

تغییر اندازه ذرات و مکان قله جذبی بر حسب تغییر غلظت نقره در لایه‌های نازک تهیه شده در شکل ۵ نشان داده شده است. از تحلیل این نمودارها مشخص می‌شود که با تغییر غلظت ماده اولیه (نیترات نقره) می‌توان اندازه نانوذرات را کنترل کرد. همچنین مشاهده می‌شود که با کاهش غلظت، اندازه ذرات کوچکتر شده و قله جذبی پلاسمونی آنها به سمت طول موجه‌ای کمتر^۱ جایه‌جا شده که با نتایج گزارش شده دیگر محققین به خوبی مطابقت دارد [۱۲، ۸].

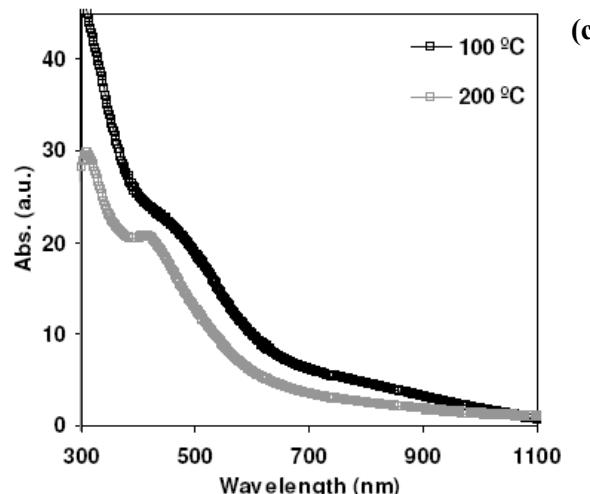
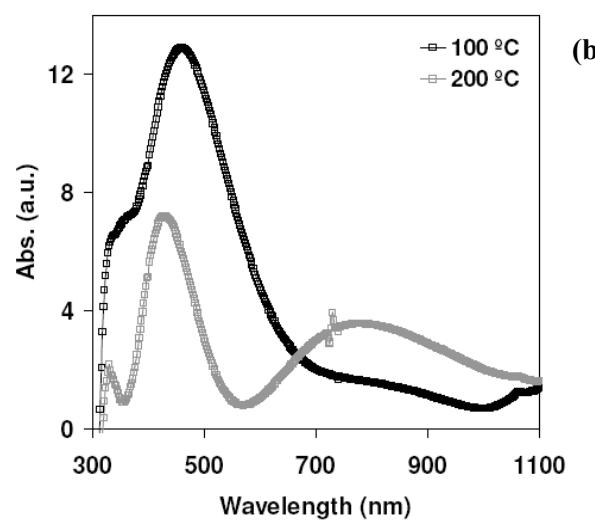
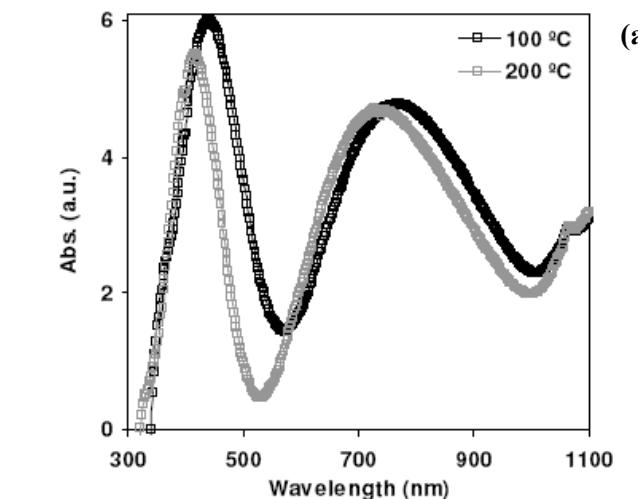
دارای ساختار C.F.C با پارامتر شبکه ۴/۱۹ آنگستروم هستند. همان‌طور که می‌دانیم، فلز نقره در حالت کپه‌ای دارای ساختار C.F.C و پارامتر شبکه آن ۴/۰۹ آنگستروم است که نشان می‌دهد پارامتر شبکه عناصر در اندازه‌های نانومتری بیشتر می‌شود [۹].

برای بررسی توپوگرافی سطح نمونه‌ها و مطالعه ساختار آنها در مقیاس نانومتری و مطالعه تأثیر درصد غلظت نقره در اندازه ذرات تولید شده در غلظت‌های مختلف از تکنیک آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) استفاده شد. شکل ۳ نمایش سه بعدی از تصویر AFM لایه نازک سیلیکا با غلظت نقره ۱/۶٪ که در دمای ۲۰۰°C پخت شده است، نشان می‌دهد. همچنین نمایش سه بعدی از تصویر AFM لایه نازک سیلیکا حاوی نانوذرات نقره با غلظت ۸٪ نقره پخت شده در دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد در این شکل مشاهده می‌شود.

برای بررسی خواص نوری لایه نازک SiO₂ حاوی ذرات نانومتری نقره، منحنی تغییرات طیف جذبی آنها را در غلظت‌های مختلف و در دو حالت خشک شده در ۱۰۰°C و پخت شده در ۲۰۰°C مورد مطالعه قرار دادیم. وقتی که اندازه ذرات، به ابعاد زیر ۱۰۰ نانومتر برستند خواص نوری آنها تغییرات جالب توجهی خواهند داشت [۱۰]. نقره در حالت کپه‌ای دارای قله جذبی در طول موج ۳۱۶ nm است در حالی که نانوذرات نقره طول موج جذبی در محدوده ۴۳۰ nm دارند



شکل ۵. نمودار تغییرات اندازه ذرات و تغییرات مکان قله جذبی (λ_{max}) نانوذرات نقره در غلظتها مختلط.



شکل ۴. نمودار طیف جذبی لایه‌های نازک سیلیکا حاوی غلظتها مختلط نقره (a) .۰/۲٪ (b) .۱/۶٪ و (c) .۸٪ نقره پخت شده در دو دمای ۱۰۰ °C و ۲۰۰ °C

۵. نتیجه‌گیری
سترنز و ساخت نانوذرات نقره در غلظتها مختلط AgNO_3 و به روش شیمیابی سل-ژل انجام شد. مشخصه‌یابی و مطالعه اثر غلظت ماده اولیه نیترات نقره و دمای پخت بر خواص نمونه‌ها توسط تکنیکهای مختلف آنالیز تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که تشکیل نانوذرات نقره در محدوده غلظتها نقره معینی صورت می‌گیرد، به طوری که با کاهش بیش از اندازه غلظت نقره نانوذرهای تشکیل نمی‌شود و با افزایش بیش از حد آن نیز اندازه ذرات به سمت حالت کپهای (بزرگتر از ۱۰۰ nm) می‌کند. برای غلظت ۰/۰٪ در شرایط بدون پخت، نانوذره تشکیل نمی‌شود ولی با پخت آن در دمای ۲۰۰ °C نانوذرات با متوسط اندازه در حدود ۴ nm به دست می‌آیند. همچنین با افزایش غلظت به ۰/۸٪ نیز چنین شرایطی ایجاد شد و ذراتی با میانگین سایز ۱۲۰ nm به دست آمدند. برای غلظتها میانی، بدون انجام عملیات پخت اندازه ذرات بین ۱۲ nm تا ۶۵ nm به دست آمدند. با کم شدن غلظت نقره جایه‌جایی قله جذبی به سمت طول موجهای کمتر، مشاهده شد که نشان دهنده کاهش اندازه نانوذرات نقره در لایه نازک SiO_2 است.

پژوهه و آقای عظیمی راد و خانم ناصری کمال تشکر و

قدردانی را دارند.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان از معاونت پژوهشی و پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف به خاطر حمایتهای مالی این

مراجع

- 4921.
7. A Babapour, O Akhavan, R Azimirad and A Z Moshfegh *Nanotechnology*, **17** (2006) 763.
 8. A Babapour, O Akhavan, A Z Moshfegh and A A Hosseini, *Thin Solid Films*, **515** (2006) 771.
 9. Charles P Poole, Jr Frank, J Owens, "Introduction to Nanotechnology", John Wiley (2003).
 10. C A Foss, G L Hornyak, J A Stockert, C R Martin, *J. Phys. Chem.*, **98** (1994) 2963.
 11. Z-J Jiange et al., *Appl. Surf. Sci.*, **233** (2004) 135.
 12. W Li et al., *J. Appl. Phys.*, **93** (2003) 9553.

1. A Henglein, *Top. Curr. Chem.*, **143** (1988) 113.
2. U Schürmann, W Hartung, H Takele, V Zaporotchenko and F Faupel, *Nanotechnology*, **16** (2005) 1078.
3. JT Lue, *J. Phys. Chem. Solids*, **62** (2001) 1599.
4. A A Scalisa, G Compagninio, L D'Ursoa, O Puglia, *Appl. Surf. Sci.*, **226** (2004) 237.
5. S A Moshkalyov, A L D Moreau, H R Gutierrez, M A Cotta and J W Swar *Materials Science and Engineering B*, **112**, 2-3 (2004) 147.
6. H J Jeon, S C Yi, S G Oh, *Biomaterials*, **24** (2003)